11 Veröffentlichungsnummer:

**0 272 362** A3

## (2)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87102822.1

(1) Int. Cl.5: **B24B** 13/015

22) Anmeldetag: 27.02.87

(30) Priorität: 22.12.86 DE 3643914

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 29.06.88 Patentblatt 88/26

Benannte Vertragsstaaten:
DE FR NL

Veröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 02.05.90 Patentblatt 90/18 (1) Anmelder: Firma Carl Zeiss

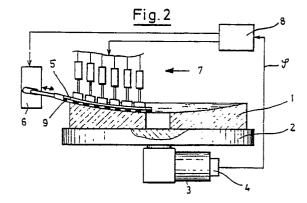
D-7920 Heidenheim (Brenz)(DE)

© Erfinder: Heynacher, Erich, Dr. Lukas-Cranach-Strasse 26 D-7920 Heidenheim(DE)

## (S4) Verfahren und Vorrichtung zum Läppen bzw. Polieren optischer Flächen.

Das relativ zum Werkzeug bewegte Werkstück (1) wird mit einem Werkzeug in Form einer streifenförmig ausgebildeten flexiblen Membran (5) bearbeitet, auf deren Rückseite Belastungselemente (7) mit einzeln ansteuerbarer Andruckkraft angeordnet sind. Die von den Belastungselementen (7) auf das Werkstück (1) ausgeübte Druckverteilung wird zeitlich, abhängig von der Position des Werkstücks (1) variert.

Mit Hilfe des Verfahrens lassen sich große optische Elemente wie z.B. Teleskopspiegel und Glanzwinkeloptik für Röntgenteleskope schneller als mit den bisher bekannten Verfahren polieren, wobei auch nicht-rotationssymmetrische Fehler der Oberfläche beseitigt werden können.



EP 0 272 362 A3

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 87 10 2822

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			***************************************	
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments n der maßgeblichen 1	nit Angabe, soweit erforderlich, Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
D,A	GB-A-2 163 076 (CARL * Insgesamt *	ZEISS)	1-6	B 24 B 13/015
A	DE-A-3 509 004 (GEORG * Ansprüche; Fig. *	WEBER)	1,2,5,6	
A	FR-A-2 448 417 (INSTI ISSLEDOVANY AKADEMII N * Ansprüche; Seite 14, 14, Zeile 6 *	AUK SSSR)	1,3,6,7	
A	US-A-3 589 078 (JOHN * Spalte 5, Zeilen 45-	L. BALA) 55; Figur 4 *	1,4,6,8	
				DOMESTIC STATE
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4
		•		B 24 B
			-	
Der vo	orliegende Recherchenbericht wurde für	•		
Recherchenort Abschlußdatum der Rech DEN HAAG 08-02-1990		Abschlußdatum der Recherche	ESCH	Prüfer BACH D.P.M.

- X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet
  Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer
  anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
  A: technologischer Hintergrund
  O: nichtschriftliche Offenbarung
  P: Zwischenliteratur

- nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument
- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument